# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-072715

(43) Date of publication of application: 16.03.1999

(51)Int.CI.

G02B 21/26 G02B 21/06

(21) Application number: 09-244864

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

27.08.1997

(72)Inventor: TOYODA SHUJI

KAWAHITO TAKASHI

#### (54) INVERTED IMAGE MICROSCOPE

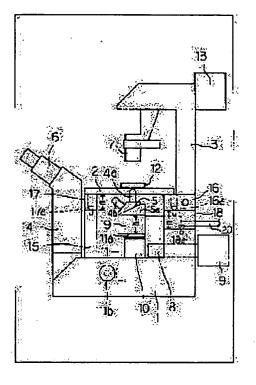
#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To newly add an optical system by providing a microscope pedestal, a stage on which a sample is placed and stage supporting members supporting the stage at both front and back end sides thereof on the microscope pedestal and

elongating/contracting the stage supporting members with

respect to the microscope pedestal.

SOLUTION: This microscope is provided with the stage supporting member 15 supporting the stage 2 in the vicinity of an ocular part support 14 and the stage supporting member 16 attached to a projecting part projecting upward in a perpendicular direction on the back surface side of the microscope pedestal 1 by a screw 16a and supporting the stage 2. The stage 2 can be attached to/detached from the members 15 and 16 and spacer members 17 and 18 respectively intervening in the members 15 and 16 are made detachable. Therefore, the members 15 and 16 are elongated/contracted in the optical axis direction of the pedestal 1. By elongating the members 15 and 16, the new space is formed between the stage 2 and a filter unit 10 on the pedestal 1 and the new optical system is additionally arranged in the space.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出壓公開番号

特開平11-72715

(43)公開日 平成11年(1999)3月16日

(51)IntCL<sup>6</sup>

識別記号

FΙ

G 0 2 B 21/26 21/06

G 0 2 B 21/26 21/06

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 6 頁)

(21) 出願番号

特額平9-244864

(71)出頭人 000004112

株式会社ニコン

(22)出願日

平成9年(1997)8月27日

東京都千代田区丸の内3丁首2番3号

(72)発明者 豊田 修治

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株

式会社ニコン内

(72)発明者 川人 敬

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株

式会社ニコン内

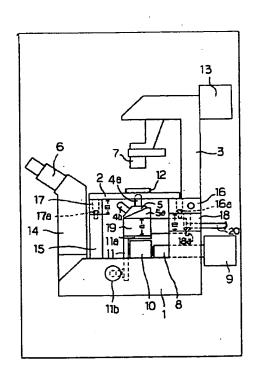
(74)代理人 弁理士 井上 義雄

(54) 【発明の名称】 倒立顕微鏡

#### (57)【要約】

【課題】光学系を新たに追加することのできる構造を有する倒立顕微鏡を提供する。

【解決手段】この倒立顕微鏡は、顕微鏡基台1と、試料12を載置するステージ2と、顕微鏡基台から延在してステージを支持するステージ支持部材15,16とを具備し、ステージ支持部材が顕微鏡基台に対して伸縮する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 顕微鏡基台と、

試料を載置するステージと、

前記顕微鏡基台に対して前記ステージを前後両端側で支持するステージ支持部材と、を具備し、

前記ステージ支持部材が前記顕微鏡基台に対して伸縮することを特徴とする倒立顕微鏡。

【請求項2】 前記ステージ支持部材が前記ステージと前記顕微鏡基台との少なくとも一方に対して着脱可能であり、前記ステージと前記顕微鏡基台との少なくとも一方と前記ステージ支持部材との間にスペーサ部材を配置することを特徴とする請求項1記載の倒立顕微鏡。

【請求項3】 前記ステージの下部に配置され、試料からの光を受けて平行光束とする対物レンズと、前記顕微鏡基台内に配置され前記対物レンズからの平行光束を集光する結像レンズと、を具備し、

新たな光学系を収納するハウジングを前記対物レンズと 前記結像レンズとの間に配置可能であることを特徴とす る請求項1または2記載の倒立顕微鏡。

【請求項4】 前記対物レンズが取り付けられるレポルバと、このレポルバを着脱可能に支持するとともに前記 顕微鏡基台に対して上下動可能に設けられたレポルバ支 持台と、を更に具備し、

前記レボルバと前記レボルバ支持台との間に前記ハウジングが配置可能であることを特徴とする請求項3記載の倒立顕微鏡。

【請求項5】 前記スペーサ部材及び前記ハウジングの 少なくとも一方の前記対物レンズの光軸方向の厚みが調 節可能であることを特徴とする請求項4記載の倒立顕微 鏡

【請求項6】 前記ハウジング内に収納される新たな光学系は、落射照明光学系、ケージド開裂光学系、レーザ光学系、レーザマニピュレーション光学系、プリズム光学系、光センサ光学系、観察光学系、及び変倍光学系の内の少なくとも1つであることを特徴とする請求項3,4または5記載の倒立顕微鏡。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、試料の観察を下方から行う倒立顕微鏡に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の倒立顕微鏡においては、ステージの下方に対物レンズと対物レンズを固定するレポルバが配置されており、落射蛍光観察をする場合、予め設けられたスペースに落射蛍光装置を取付けて試料観察を行う。この落射蛍光装置の光源として水銀灯やキセノンランブが一般に用いられている。また、特開昭60-53916号公報に開示されるように、落射蛍光装置から別の装置に切替ることのできる顕微鏡が公知である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、観察対象によってはレーザ光を対物レンズに導入してコンフォーカル光学系を形成したり、ケージド試薬開裂光学系、レーザマニピュレーション光学系を同時に使用できることが要05 求されることがある。

【0004】倒立顕微鏡において、対物レンズの上下動機構を用いて試料に対するピント合わせを行うが、この機構の上下動のストロークは、10mm以下の場合が多く、また、ステージが顕微鏡の基台に固定され、ステージと基台との高さ方向の位置関係を変えることはできず、その上、顕微鏡の対物レンズの光軸方向に新たな光学系を追加することができない。また、倒立顕微鏡の対物レンズと結像レンズとの間隔は固定されている。このように、従来技術の倒立顕微鏡では、落射照明光学系を対物レンズの光軸方向に積層した構造において新たに上述のような光学系を追加して配置することはできなかった。

【0005】本発明の目的は、光学系を新たに追加することのできる構造を有する倒立顕微鏡を提供することで20 ある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題達成のため、本発明による倒立顕微鏡は、顕微鏡基台と、試料を載置するステージと、前記顕微鏡基台に対して前記ステージを前後両端側で支持するステージ支持部材と、を具備し、前記ステージ支持部材が前記顕微鏡基台に対して伸縮することを特徴とする。

【0007】本発明によれば、ステージ部材が顕微鏡基台に対して伸びるように構成されるから、ステージ部材30 と顕微鏡基台との間に新たな空間を形成することができる。従って、この空間に新たな光学系を追加して配置することが可能となる。これにより、倒立顕微鏡において新たな光学系による観察が可能となり、倒立顕微鏡の利用範囲が広がる。

35 【0008】また、前記ステージ支持部材が前記ステージと前記顕微鏡基台との少なくとも一方に対して着脱可能であり、前記ステージと前記顕微鏡基台との少なくとも一方と前記ステージ支持部材との間にスペーサ部材を配置することにより、上述のステージ部材の伸縮構造を40 構成できる。

【0009】また、前記ステージの下部に配置され、試料からの光を受けて平行光束とする対物レンズと、前記顕微鏡基台内に配置され前記対物レンズからの平行光束を集光する結像レンズとを具備し、新たな光学系を収納するハウジングを前記対物レンズと前記結像レンズとの間に配置可能であるように構成することができる。

【0010】かかる構成により、試料からの光が平行光 束となって出射する対物レンズと結像レンズとの間に新 たな光学系を配置するので、この新たな光学系を配置す 50 ることによる顕微鏡の光学性能にほとんど影響を与えず 光学性能の低下は生じない。

【0011】また、前記対物レンズが取り付けられるレ ポルバと、このレポルバを着脱可能に支持するとともに 前記顕微鏡基台に対して上下動可能に設けられたレポル バ支持台とを更に具備し、前記レボルバと前記レボルバ 支持台との間に前記ハウジングが配置可能であるように

【0012】また、前記スペーサおよび前記ハウジング の少なくとも一方の前記対物レンズの光軸方向の厚みが 調節可能であるように構成できる。これにより、ハウジ ングの厚さに対応してスペーサ部材の厚さを選択するこ とができ、ハウジングの厚さの分だけステージ部材を伸 ばすことができる。

【0013】また、前記ハウジング内に収納される新た な光学系は、落射照明光学系、ケージド開裂光学系、レ ーザ光学系、レーザマニピュレーション光学系、プリズ ム光学系、光センサ光学系、観察光学系、及び変倍光学 系の内の1つまたは複数を選択して配置することができ る。これにより、倒立顕微鏡において種々の観察及び観 察をしながらの実験が可能となる。

【発明の実施の形態】本発明による実施の形態について 図面を用いて説明する。図1及び図2は本発明の実施の 形態による倒立顕微鏡の側面図である。図1に示す倒立 顕微鏡は、顕微鏡の基台1と、この基台1の前面側に設 けられ接眼部6を支持する接眼部支柱14と、基台1の 背面側に設けられ透過照明用ランプハウス13等を支持 する照明支柱3と、シャーレ12等の試料を載せるステ ージ2と、基台1から垂直方向上方に突出するように設 けられるとともにステージ2を接眼部支柱14の近傍に おいて着脱可能に支持する第1のステージ支持部材15 と、基台1の背面側に垂直方向上方に突出するように一 体に設けられた突出部1aに対してねじ16aにより取 り付けられステージ2を着脱可能に支持する第2のステ ージ支持部材16とを備える。照明支柱3は第2のステ ージ支持部材16により支持される。このようにして、 図1に示す倒立顕微鏡は、ボックス構造に構成されてい

【0015】図1の倒立顕微鏡は、更に、ステージ2の 下方に配置された複数の対物レンズ4a,4bと、これ らの対物レンズ4a, 4bを切替のため回転可能に取り 付けたレボルバ5と、レボルバ5の支持部5 a が着脱可 能に取り付けられたレポルパ支持台11aを有する焦準 部材11とを備える。焦準部材11は、水平方向に配置 されたレポルバ支持台11aの一端から垂直方向下方に 基台1内まで延在し、基台1内に図1の破線で示すラッ ク・ピニオン機構を備えて焦準ノブ11bの回転により 上下方向に移動する。 焦準ノブ11 b を回転させること により、図1に示すように観察可能状態に位置する対物 レンズ4 a をステージ2 に対して上下動させて合焦させ 50 7,18 を取り外すことのできる構成とすることによ

る。

【0016】また、図1に示す倒立顕微鏡には、落射蛍 光観察のための落射蛍光装置が顕微鏡基台1に設けられ ている。この落射蛍光装置は、水銀ランプ9と、試料照 05 明のための光学系を含む照明光投光装置8と、焦準部材 11のレポルバ支持台11aと顕微鏡基台1との間の空 間に配置されフィルタ等の光学系から構成されるフィル タユニット10とを備える。フィルタユニット10の光 学系は、ダイクロイックミラー、励起光フィルタ、吸収 10 フィルタ、ミラー等から構成される。対物レンズ4aの 光軸方向に対して垂直方向に入射する水銀ランプ9から の光がフィルタユニット10により対物レンズ4aの光 軸方向に曲げられてステージ2上の試料12に向かう。 【0017】また、図1の倒立顕微鏡は、透過照明観察 15 のため、照明支柱3に支持された透過照明用ランプハウ ス13からの光をステージ2上の試料12に集光するコ ンデンサレンズ7を備える。また、フィルタユニット1 0の下方であって顕微鏡基台1内に結像レンズ(図示省 略)が配置されている。対物レンズ4a,4bは無限遠 20 光学系から構成され、対物レンズ4a, 4bから射出し た光が平行光束となってこの平行光束が結像レンズに入 射するように構成されている。

【0018】次に、図1に示す倒立顕微鏡に新たな光学 系等を含む装置を追加して配置する場合について図2に 25 より説明する。図1に示した状態においてステージ2を 第1のステージ支持部材15及び第2のステージ支持部 材16から取り外し、図2に示すように、第1のステー ジ支持部材15の上端に第1のスペーサ部材17をねじ 17aにより取り付ける。

30 【0019】一方、第2のステージ支持部材16を顕微 鏡基台1の突出部1aからねじ16aを弛めて取り外し てから、突出部1aにねじ18aにより第2のスペーサ 部材18を取り付ける。次に、図2に示すように第2の スペーサ部材18上に第2のステージ支持部材をねじ1 35 6 aにより取り付ける。上述の第1のスペーサ部材17 及び第2のスペーサ部材18の上下方向(対物レンズ4 aの光軸方向)の各厚さは、図2に示すようにともにm であり、等しく構成されている。

【0020】次に、ステージ2を第1のスペーサ部材1 40 7及び第2のステージ支持部材16に取り付けるること により、倒立顕微鏡を図2に示す状態にすることができ る。また、以上の組立順序を逆に行えば、倒立顕微鏡の 各ステージ支持部材を図2の伸びた状態から図1の縮ん た状態に戻すことができる。

45 【0021】このようにして、倒立顕微鏡において、ス テージ2を第1及び第2のステージ支持部材15,16 に対して着脱でき、第1及び第2のスペーサ部材17, 18をそれぞれ第1及び第2のステージ支持部材15, 16に介在させ、かつ第1及び第2のスペーサ部材1

り、第1及び第2のステージ支持部材15,16を顕微 鏡基台1に対して対物レンズ4 a の光軸方向に伸縮する 構造とすることができる。この構造により、各ステージ 支持部材15,16が伸ばされると、ステージ2と顕微 鏡基台1上のフィルタユニット10との間に新たな空間 が形成される。

【0022】更に、レポルバ5の支持部5aと焦準部材 11のレポルバ支持台11aとを分離してから、支持部 5 aとレポルバ支持部材 1 1 a との間に追加の光学系装 置19を配置する。この場合、この追加の光学系装置1 9はハウジング内に納められ、そのハウジングの上下方 向 (対物レンズ4aの光軸方向) の厚されは、第1及び 第2のスペーサ部材の厚さm以下に構成されている。

【0023】追加された光学系装置19は、例えば生物 観察において用いられるケージド開裂装置から構成さ れ、このケージド開裂装置に対して外部に配置されたレ ーザ装置等から第2のスペーサ部材18内を通して配置 された光ファイバ20により光を導くことができる。ケ ージド開裂装置とは、例えば生物細胞を観察する場合 に、レーザ光等をスポット的に目的の細胞部分に照射し て細胞の一部を破壊し、その破壊により生じた開裂部分 に蛍光試薬を入れることができるように構成されたもの である。従って、倒立顕微鏡に図1に示すように設けら れていた落射蛍光装置8,9,10とともに使用するこ とによって、生物細胞の目的部分を蛍光観察することが できる。このケージド開裂装置はミラー等を含む光学系 を備え、この光学系によって、対物レンズ4aの光軸方 向に対して垂直方向に入射する光ファイバ20からの光 が対物レンズ4 aの光軸方向に曲げられステージ2上の 試料12に向かう。

【0024】以上のように、本実施の形態の倒立顕微鏡 によれば、従来の落射蛍光装置に加えて新たな光学系を 含む装置を対物レンズの光軸方向に積層して追加できる ので、追加の光学系装置により観察機能が増え、両装置 の同時使用も可能であるため各種の観察及び観察しなが らの実験が容易に行えるようになり、倒立顕微鏡の利用 範囲が広がる。

【0025】また、追加の光学系装置19のハウジング の光軸方向の厚さnは、第1及び第2のスペーサ部材の 厚さm以下に設定されているから、対物レンズがステー ジに当たってしまうことはなく、観察時における顕微鏡 の合焦操作に支障がない。

【0026】また、追加の光学系装置と落射蛍光装置と は、ともに対物レンズ4aと結像レンズとの間に配置さ れており、対物レンズ4 aからでた光は平行光束である ため、新たな光学系装置を追加しても、顕微鏡の光学性 能にはほとんど影響を与えず、光学性能の低下は生じな く観察にも支障がない。

【0027】なお、本実施の形態では、顕微鏡基部1上 に設けられた装置が、落射蛍光装置であり、追加の光学 50 【符号の説明】

系装置が、ケージド開裂装置であったが、本発明はこれ に限定されるものではなく、落射照明光学系装置、光の 波長を変えることのできる落射照明光学系装置、ケージ ド開裂装置、レーザ装置、レーザマニピュレーション光 05 学系装置、偏光プリズム光学系装置、光センサ光学系装 置、及び変倍光学系装置等を目的に応じて種々組み合わ せることができ、更に新たな第3の光学系装置を上述の 空間に配置することもできる。また、対物レンズとレポ ルバとの間に第2の対物レンズ上下動装置を配置するこ 10 ともできる。

【0028】また、スペーサ部材は、図2に示す位置に 限らずに、各ステージ支持部材が顕微鏡基台に対して対 物レンズの光軸方向に伸びるように配置されるものであ れば、その配置位置はどこであってもよく、例えば顕微 15 鏡基台とスペーサ部材との間等であってよい。

【0029】また、スペーサ部材は、その厚さmを種々 変えることができ、追加光学系装置のハウジングの厚さ nに対応して厚さmの異なるスペーサ部材を用いること ができる。ハウジングの厚さnに応じてスペーサ部材の 20 厚さmを選ぶことができるように、複数のスペーサ部材 を用意しておくことができる。

【0030】また、上述のスペーサ部材を合成樹脂等か らなる断熱材料から構成することができる。これによ り、試料を設定された温度に保つヒーティングステージ 25 を使用する場合、ステージの温度が顕微鏡基台にステー ジ支持部材を通して伝熱する量を低く抑えることがで き、保温効率が向上する。

【0031】また、本発明においてステージ支持部材の 伸縮構造は、スペーサ部材の介在構造のみに限定され

30 ず、例えば、図3に示すようにステージ支持部材を2つ の分離した部材15、18、31、32から構成し、一 方を大きい筒状部材15、18にし、他方31、32を この筒状部材の中におさまるように構成した入れ子構造 にしたものであってもよい。

【0032】本発明は上述した図2、図3に示す実施形 態の構成に限定されるものではなく、種々の構成をとり 得る。

[0033]

【発明の効果】本発明によれば、倒立顕微鏡において新 40 たな光学系を追加できる構造を提供することができ、種 類の異なる光学系による観察が可能となり倒立顕微鏡の 利用範囲が広がる。

【図面の簡単な説明】

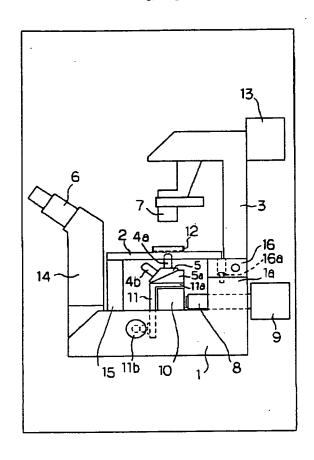
【図1】本発明による第1実施の形態の倒立顕微鏡の側 45 面図である。

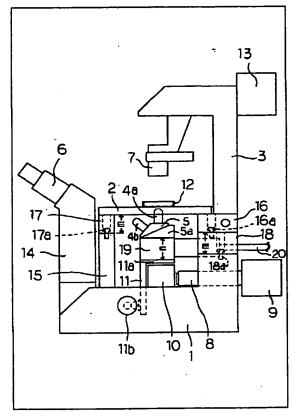
【図2】図1の倒立顕微鏡に新たな光学系を追加した状 態を示す側面図である。

【図3】本発明による第2実施の形態の倒立顕微鏡であ

1	類微鏡基台		1 6	第2のステージ支持部材
2	ステージ		1 7	第1のスペーサ部材
4a, 4b	対物レンズ		1 8	第2のスペーサ部材
5	レボルバ		1 9	追加の光学系装置
1 1	魚準部材	05	m	第1及び第2のスペーサ部材
11a	レポルバ支持台		の光軸方向厚さ	
1 2	シャーレ(試料)		n	追加の光学系装置のハウジン
1 5	第1のステージ支持部材		グの光軸方向厚さ	

【図1】 【図2】





【図3】

